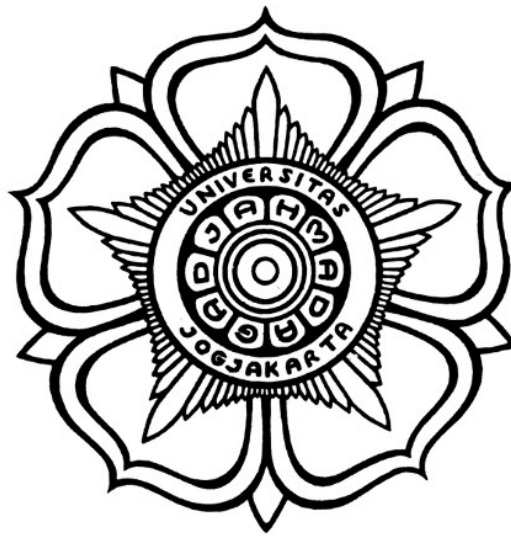


**ANALISIS PERUBAHAN KONFIGURASI WINDING DAN
UKURAN INTI TERHADAP NILAI *LEAKAGE INDUCTANCE* PADA
TRAFO FREKUENSI TINGGI BERBASIS SIMULASI
MENGUNAKAN *FINITE ELEMENT METHOD***

SKRIPSI



Disusun oleh:

FELIX AUSTIN CAHYADEWA
19/443577/TK/48773

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERUBAHAN KONFIGURASI *WINDING* DAN UKURAN INTI TERHADAP NILAI *LEAKAGE INDUCTANCE* PADA TRAFO FREKUENSI TINGGI BERBASIS SIMULASI MENGGUNAKAN *FINITE ELEMENT METHOD*

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Teknik

pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik

Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh :

Felix Austin Cahyadewa
19/443577/TK/48773

Telah disetujui dan disahkan

pada tanggal, 01 September 2023

Dosen Pembimbing I



Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.
NIP. 197307061999031005

Dosen Pembimbing II



Naufal Hilmi Fauzan, S.Si., M.T.
NIP. 111199712202201101



**ANALISIS PERUBAHAN KONFIGURASI *WINDING* DAN UKURAN INTI TERHADAP
NILAI *LEAKAGE INDUCTANCE* PADA TRAFO FREKUENSI TINGGI BERBASIS
SIMULASI MENGGUNAKAN *FINITE ELEMENT METHOD***

Dipersiapkan dan disusun oleh

Felix Austin Cahyadewa
19/443577/TK/48773

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal : **01 September 2023**

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.

Pembimbing Pendamping

Naufal Hilmi Fauzan, S.Si., M.T.

Anggota Dewan Penguji Lain

Dr.-Ing. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.

Dr. Ir. M. Isnaeni Bambang Setyonegoro, M.T.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Tanggal: 03 Oktober 2023

Pengelola Program Studi: Sarjana Teknik Elektro

Dr.Eng. Ir. Adha Imam Cahyadi, S.T., M.Eng., IPM.

NIP 197911022008121001

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi



Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.

NIP 197802242002121001

